

表裏3次元測定システム TOMOS 100H

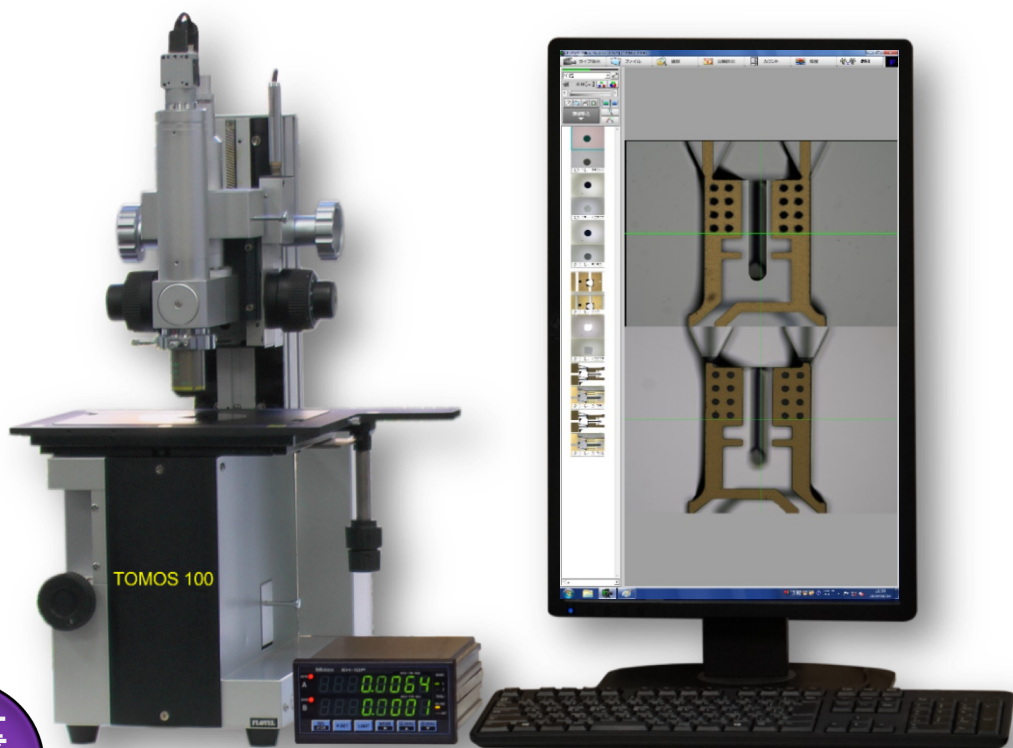
厚さ
測定

段差
測定

表裏
座標

形状
計測

表裏
撮影

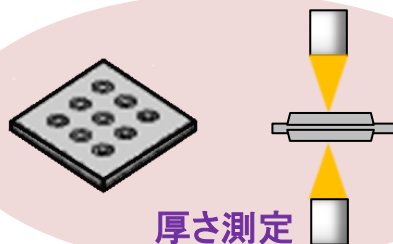


表裏顕微鏡で射影パターン照明によりMEMS等の電子部品の段差や厚みが精密に測定できます。

表裏の座標、形状を、±1μmの精度で測定できます。



段差測定



厚さ測定

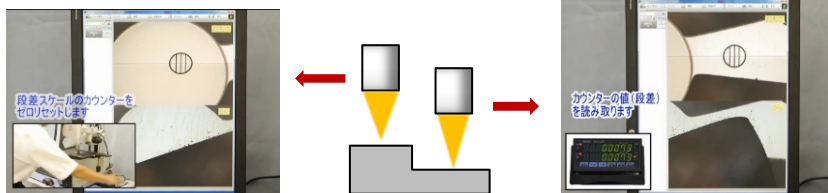
●射影パターン照明

試料に射影パターン照明でピント位置調整



●段差測定

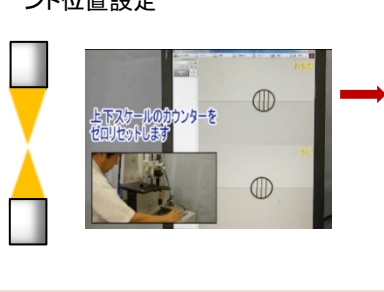
段差のある試料の2点にそれぞれ射影パターンを合わせ、その差をスケールで読み取る



●厚み測定

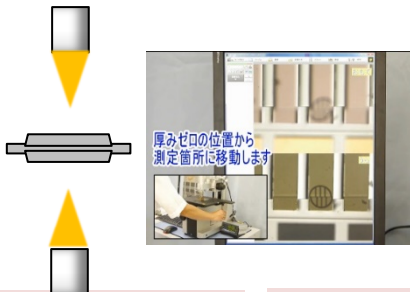
① ゼロ点校正

試料無しで表裏射影パターンでピントを合わせ、絶対厚みゼロポイント位置設定



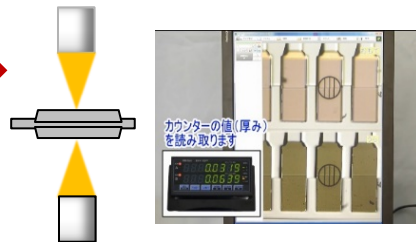
② 試料設置

対物レンズ間を広げて測定試料をステージに設置する



③ 厚み測定

試料の表裏それぞれに射影パターンを合わせ、その差をスケールで読み取る

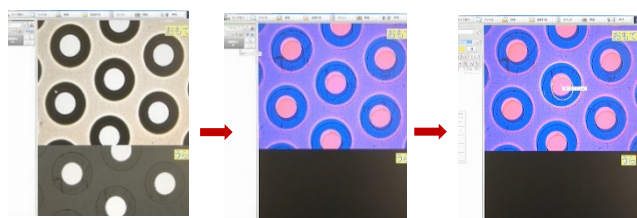


●表裏座標、形状測定

表裏撮影

表裏映像重畳

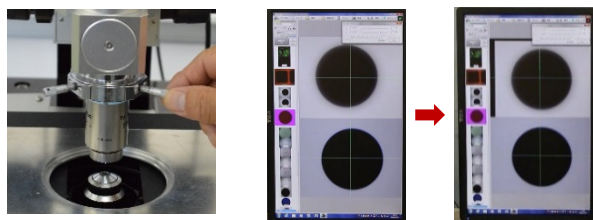
ずれ量測定



●表裏顕微鏡の光軸、倍率、角度を補正

対物レンズ光軸調整

画像処理で光軸、倍率、角度補正



●主な仕様

光学系

- ・ 鏡筒 : 2 (正立、倒立)
- ・ 対物レンズ : 2 (10倍)
- ・ 射影パターン : 2種類
- ・ 粗微動調整 : 手動 (正立、倒立)
- ・ 照明 : 可変 (正立、倒立)
- ・ カメラ : 2 (正立、倒立)
- ・ スケール : 2 分解能 ±1μm

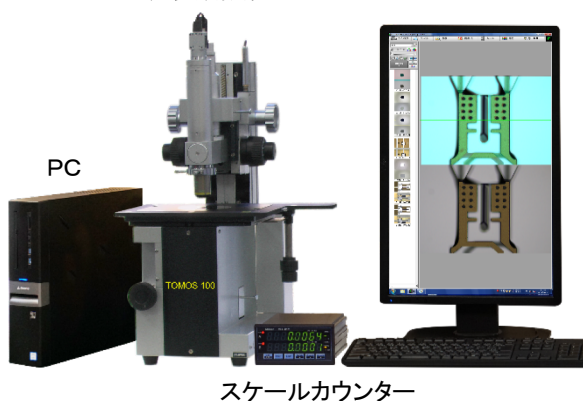
制御部

- ・ PC-OS : Windows10
- ・ 表示モニター : 2 画面表示
- ・ 計測機能 測定 : 画像ファインリング、座標位置ずれ測定、段差測定、厚み測定

●システム

表裏顕微鏡

2画面表示モニター



■お問合せ

ARVIS アルビス株式会社
 〒182-0026 東京都調布市小島町1-1-1
 UECアライアンスセンター301
 株式会社フローベル社内 アルビスショールーム
 TEL : 080-4123-7842 (営業部)
 Web : <http://www.arvis-co.jp/microeye/seit.html>
 E-mail : support@arvis-co.jp

FLOVEE 株式会社 フローベル

〒150-0003 東京都渋谷区恵比寿3-1-7 タマビル恵比寿3階
 TEL : 03-5475-5180 FAX : 03-5475-5181